大视场双轴光电自准直仪 精度1″

产品型号: MC030-WF200-5700

上海研润光机科技有限公司

电话: 400-812-7833 | 021-58391850

地址: 上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 | 邮编: 201411

联系邮箱: shanghai@yr17.net

服务邮箱: rockwei@yr17.net



产品图片

产品介绍

大视场系列光电自准直仪主要应用于实验室对测角范围要求比较大的场景，凭在科研探索与工业研发中，当面对大型设备或复杂结构的精确角度测量时，它能有效覆盖更广泛的测量范围。

产品应用

机床行业：主要应用于机床导轨直线度、平行度、垂直度以及大型平板的平面度检测； 光学行业：主要用于光学产品装调，各种棱镜的角度测量等； 计量与科研：主要用于检定校准其他检测设备或工具，以及各种科学研究活动如各种精密角度测量或动态监测产品的位置变化（角度）或者动态测量运动产品的角度变化或直线度误差等； 大理石精度检测：适用于大理石直线度、平行度、垂直度、平面度等几何精度检测； 编码器：主要用于角度编码器的定位精度或重复性精度检测。

技术参数

参数	原站数据
物镜焦距	200mm
通光口径	48mm
光轴中心高度	78mm

参数	原站数据
视场范围（X、Y）	5700*5700″
分辨率	0.1″、0.01″、0.001″、0.0001″可调 (arc sec. 角秒)
示值精度	±1000″≤ ±1″；全程≤ ±2″
重复性	≤ 0.5″
中心波长	625nm
测量频响	≤ 30HZ(Hz TYP.)
光源类型	半导体 LED 光源
通讯方式	USB3.0
第三方通讯接口	RS-232
显示方式	基于普通 PC 的软件显示
电源	5V1A
仪器尺寸（长 * 宽 * 高）	288*125*115mm
主机重量	3.92kg

使用与核对说明

本资料依据保存的官方页面整理。分辨率不等于准确度；参数的量程、环境及配置条件应一并核对。选型和验收以双方确认的技术文件为准。

相关标准参考

以下按产品标准或应用方法列出相关参考，不表示该产品已获得认证或已被证明符合所列标准。是否采用、适用版本、检测条件和验收要求以双方确认的技术协议为准。

• JB/T 8232-2024 自准直仪 — 产品标准参考

与本产品的应用关系: 产品标准候选；型号适用性与检验记录待核对，不表示符合。

官方资料: https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=2A77AF2B5400A92BE06397BE0A0AEC68

• GB/T 17421.1-2023 机床检验通则：无负荷或准静态几何精度 — 应用方法参考

与本产品的应用关系: 应用方法、几何规范或评价参考；不表示本仪器符合该标准。

官方资料: https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=78933E2E34BF89D2AA942DF59B0DEB4C

• GB/T 1958-2017 产品几何技术规范：几何公差检测与验证 — 应用方法参考

与本产品的应用关系: 应用方法、几何规范或评价参考；不表示本仪器符合该标准。

官方资料: https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=7E583F4C34EDA084FBEADF506B26ECDD

• GB/T 18779.1-2022 产品几何测量检验：合格与不合格判定规则 — 应用方法参考

与本产品的应用关系: 应用方法、几何规范或评价参考；不表示本仪器符合该标准。

官方资料: https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=31282F9BD33688E01A8DFF87DF802900

• ISO 230-1:2012 机床检验：无负荷或准静态几何精度 — 应用方法参考

与本产品的应用关系: 应用方法、几何规范或评价参考；不表示本仪器符合该标准。

官方资料: https://www.iso.org/standard/46449.html

• ISO/TR 230-11:2018 机床几何检验用测量仪器 — 应用方法参考

与本产品的应用关系: 仪器选型技术报告；不是产品制造或合格认证标准。

官方资料: https://www.iso.org/standard/71882.html

• ISO 12780-1:2011 直线度：术语与参数 — 应用方法参考

与本产品的应用关系: 应用方法、几何规范或评价参考；不表示本仪器符合该标准。

官方资料: https://www.iso.org/standard/53622.html

• ISO 12781-1:2011 平面度：术语与参数 — 应用方法参考

与本产品的应用关系: 应用方法、几何规范或评价参考；不表示本仪器符合该标准。

官方资料: https://www.iso.org/standard/53624.html

• ISO 14253-1:2017 GPS测量检验：合格与不合格判定规则 — 应用方法参考

与本产品的应用关系: 应用方法、几何规范或评价参考；不表示本仪器符合该标准。

官方资料: https://www.iso.org/standard/70137.html

资料来源: https://www.cnbai.net/product.php?productId=87

文件生成日期: 2026-11-16